

Calendario Lezioni 2009/10

Giorno	Data	Teoria	Lab.	Prog. Ore	Docente	Argomento
gio	7-Oct	2		2	Villa	Introduzione al corso + Operazioni fondamentali su funzioni logiche
ven	8-Oct	3		5	Villa	Operazioni fondamentali sulle funzioni logiche
gio	14-Oct	2		7	Villa	Logica a piu' valori
ven	15-Oct	3		10	Villa	Reti a piu' livelli
gio	21-Oct	2		12	Villa + Di Guglielmo	Ottimizzazione logica a due livelli a piu' valori; espresso
ven	22-Oct		3	15	Villa	Diagrammi di decisione binaria
gio	28-Oct	2		17	Villa	Operazioni su reti a piu' livelli; SIS
ven	29-Oct		3	20	Villa + Di Guglielmo	Operazioni su reti a piu' livelli; SIS
gio	4-Nov		2	22	Villa + Di Guglielmo	Operazioni con diagrammi di decisione; CUDD
ven	5-Nov	3		25	Fummi	definizione e caratterizzazione dei difetti, modellazione dei guasti
gio	11-Nov	2		27	Fummi	simulazione dei guasti, generazione del test per circuiti combinatori
ven	12-Nov		3	30	Fummi + Di Guglielmo	Fastscan, DfTAdvisor
gio	18-Nov	2		32	Fummi	generazione del test per circuiti sequenziali
ven	19-Nov	3		35	Fummi	design for testability, circuiti self testing
gio	25-Nov		2	37	Fummi + Di Guglielmo	Flextest, BISTDesigner
ven	26-Nov	3		40	Fummi	tolleranza ai guasti, circuiti di tolleranza ai guasti
gio	2-Dec			40		NO LEZIONE
ven	3-Dec		3	43	Fummi + Di Guglielmo	ACIF, Certitude
gio	9-Dec			43		NO LEZIONE
ven	10-Dec	3		46	Pravadelli	Verification
gio	16-Dec	2		48	Pravadelli	Property checking
ven	17-Dec	3		51	Pravadelli	Property coverage
gio	13-Jan		2	53	Pravadelli + Di Guglielmo	NuSMV
ven	14-Jan		2	55	Pravadelli + Di Guglielmo	NuSMV
gio	20-Jan	2		57	Pravadelli	Property coverage
ven	21-Jan	3		60	Pravadelli + Di Guglielmo	Vacuity Analysis
gio	27-Jan		2	62	Pravadelli + Di Guglielmo	FoCs
ven	28-Jan		2	64	Pravadelli + Di Guglielmo	MultiCoVer

teoria (13 ore)

Modelli di difetto e guasto

definizione e caratterizzazione dei difetti, modellazione dei guasti
simulazione dei guasti,

generazione del test per circuiti combinatori

Generazione del collaudo

generazione del test per circuiti sequenziali

design for testability, circuiti self testing

tolleranza ai guasti, circuiti di tolleranza ai guasti

laboratorio (8 ore)

Fastscan, DfTAdvisor
Flextest, BISTDesigner
ACIF, Certitude